

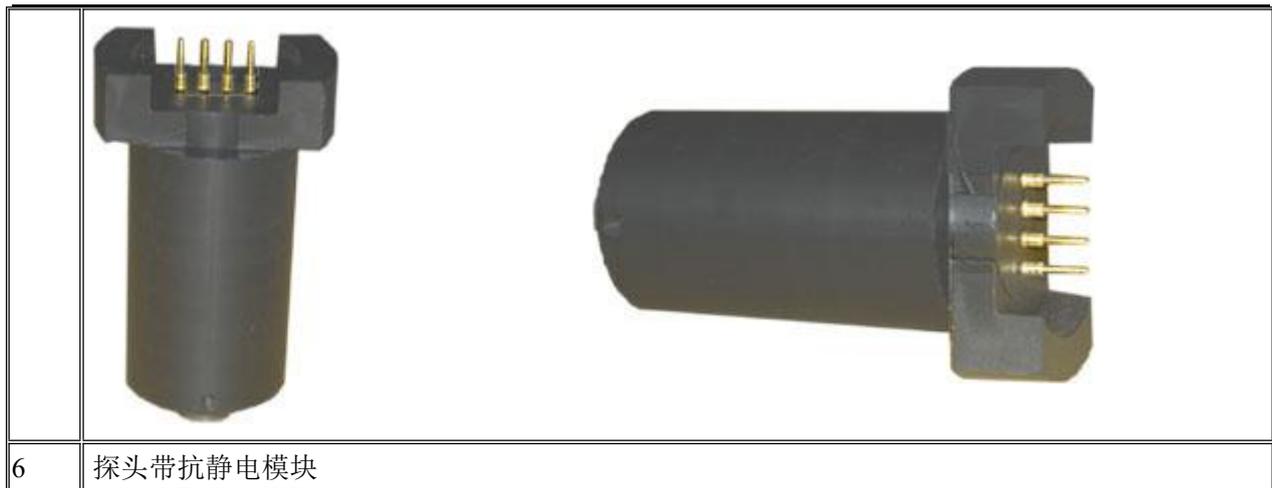
ST-21 型方块电阻测试仪



ST-21 型方块电阻测试仪是一种依照类似的国家标准和美国 A.S.T.M 标准，专门测量半导体薄层电阻(表面电阻)的新型仪器，可用于测量一般半导体材料、导电薄膜(ITO 透明氧化膜)，金属薄膜……等同类物质的薄层电阻。

该仪器以大规模集成电路为主要核心；用基准电源和运算放大器组成高精度稳流源；带回路有效正常指示电路；并配以大型 LCD 显示读数，使仪器具有体积小、重量轻、外形美、易操作、测量速度快、精度高的特点。

1	采用大规模集成电路作为仪器的主要部分，测量准确稳定，低功耗；
2	以大屏幕 LCD 显示读数，直观清晰；
3	采用单个电池供电，带电池欠压指示；
4	体积≤175mm X90mm X42mm，重量≤300g；
5	特制之手握式探笔，球形探针、镀金探针有效接触被测材料及保护薄膜



6 探头带防静电模块

测量范围	按方块电阻量值大小分为二个量程档： 1.方块电阻 1.00~199.99Ω/□； 2.方块电阻 10.0~1999.9Ω/□； 最小分辨率：0.01Ω/□
恒流源	测量过程误差：≤±0.8%
模数转换器	量程：0~199.99mv； 分辨率：10μv； 方式：LCD 大屏幕显示；极性，超量程均自动显示；小数点同步显示；
测量不确定度	在整个量程范围内，测量不确定度≤5%
四探针探头规格	间距：1mm、1.59mm、3.8mm；偏差≤2%；游移率≤0.3%；绝缘电阻≥500MΩ
电源	9V 叠层电池 1 节

◆ ST-21 方块电阻测试仪可**选配 HP 系列四探针探头**的型号及规格：

型号 (Model)	曲率半径 (Radius)	压力 (loads)	探针间距 (spacing)	探针排列 (Arrangement)
HP-501	0.5mm	100g	3.8mm	直线
HP-502	0.75mm	100g	3.8mm	直线
HP-503	0.1mm	150g	1mm	直线
HP-504	0.5mm	100g	1.59mm	直线

◆ ST-21 方块电阻测试仪可**选配 SP-601 型方型四探针探头**的型号及规格：

型号 (Model)	曲率半径 (Radius)	压力 (loads)	探针间距 (spacing)	探针排列 (Arrangement)
SP-601	0.5mm	100g	1.59mm	方形